

СОДЕРЖАНИЕ

Фундаментальные исследования

<i>Егоркин В.И., Журавлëв М.Н., Канаев В.В.</i> Моделирование электронного транспорта в туннельно-резонансных гетероструктурах GaN/AlGaN	3
--	---

Материалы электронной техники

<i>Вигдорович Е.Н.</i> Кристаллофизические свойства гетероструктур $\text{In}_{1-y}\text{Ga}_y\text{As}_{1-x}\text{N}_x/\text{GaAs}$	9
--	---

Микроэлектронные приборы и системы

<i>Денисова Е.А., Уздовский В.В., Хайновский В.И.</i> Многоканальные фотоячейки для преобразователей изображения с разделением цветов	14
---	----

<i>Дюжев Н.А., Махиборода М.А.</i> Математическое моделирование тепловых процессов, сопровождающих автозаделенную эмиссию из наноразмерного острия ...	22
--	----

<i>Энис А.В., Энис В.И.</i> Микросхемы защиты литий-ионных аккумуляторов	27
--	----

Нанотехнология

<i>Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Романов А.В.</i> Температурная зависимость комплексной диэлектрической проницаемости композитов на основе диэлектрических матриц и входящих в их состав углеродных нанотрубок	33
--	----

<i>Белов А.Н., Гаврилин И.М., Гаврилов С.А., Дронов А.А., Шулятьев А.С.</i> Высокоупорядоченные массивы нанотрубок TiO_2 в фотоэлектрических преобразователях на гибком носителе	38
---	----

<i>Бессонова А.В., Бобринецкий И.И., Неволин В.К., Симунин М.М.</i> Методики исследования сорбционных свойств агломератов углеродных нанотрубок	43
---	----

<i>Максимов К.С.</i> Двумерные дефекты и проблема идентификации структуры наноразмерных частиц	51
--	----

Информационные технологии

<i>Шабанов Б.М., Телегин П.Н., Телегина Е.В.</i> Влияние архитектуры параллельных вычислительных систем на модели программирования	60
<i>Поташникова А.В., Чекасин А.И., Стрельцов Е.В., Степанов Н.В.</i> Расширение спектра ИК-сигналов на базе матрицы микрозеркал для атмосферных оптических линий связи.....	66

Интегральные радиоэлектронные устройства

<i>Баранов А.В.</i> СВЧ-усилитель мощности класса Е с последовательным формирующим контуром	71
---	----

Схемотехника и проектирование

<i>Беспалов В.А., Глебов А.Л., Кононов А.Н.</i> Метод обfuscации цифровых схем, основанный на использовании логических импликаций	81
---	----

Конференции. Выставки

<i>Вернер В.Д., Резнев А.А., Сауров А.Н.</i> «Чему учит кризис?» (выставка «Электроника - 2010», г. Мюнхен, Германия).....	87
--	----

8 февраля - День российской науки. Миэтовские научные чтения	2 стр. обложки
9th IEEE East-West Design&Test Symposium (Севастополь, Украина, 09 - 12 сентября 2011)	4 стр. обложки

Contents	95
Abstracts	96
К сведению авторов	99